

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN (SNI)

Resolución N° 5
De 24 de octubre de 2017

El Secretario Técnico del Sistema Nacional de Investigación (SNI),

En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 56 de 2007,

CONSIDERANDO:

Que el Sistema Nacional de Investigación, en adelante SNI, fue creado mediante la Ley 56 de 2007, la cual se encuentra reglamentada por la Resolución del Consejo Directivo Nacional No. 01 de 12 de enero de 2011, en adelante el Reglamento.

Que el cinco (5) de octubre de 2016, se abrió la *Convocatoria Pública para el Segundo Reingreso de Miembros al Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá 2017*, en las categorías de Investigador Nacional (subcategorías I y II) e Investigador Distinguido.

Que, en la Convocatoria Pública antes señalada, se estableció como plazo para presentar las propuestas el veintiocho (28) de abril de 2017 a la tres de la tarde (3:00 p.m.) hora exacta.

Que el doctor Abdiel Pino, varón, panameño, con cédula de identidad personal 8-351-692, presentó su solicitud en la *Convocatoria Pública para el Segundo Reingreso de Miembros al Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá 2017*, como Investigador Nacional I.

Que el 3 de agosto de 2017 fue publicada en la página electrónica de SENACYT la lista de investigadores avalados por el Comité de Evaluación de la *Convocatoria Pública para el Segundo Reingreso de Miembros al Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá 2017*, entre los cuales no se lista el código del doctor Pino dentro de ninguna de las categorías del SNI.

Que el doctor Pino presentó dentro del término legal establecido en el artículo 55 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigación, el Recurso de Reconsideración en contra del dictamen de la Comisión de Evaluación que no lo avala como investigador del SNI.

Que como parte de su sustentación el recurrente menciona lo siguiente:

“ ...

- 1.1. Los artículos “Optical inspection methods as an alternative for the improvement of industrial processes” y “Determination of surface properties using speckle metrology: case of special papers” que aparecen publicados en el “Journal of Applied Management Science (ISSN: 2455-9229)” y en el “Journal of Applied Science (ISSN: 2455-6653)”, respectivamente, fueron sometidos a un proceso de revisión por pares tal como se señalan en el medio de comunicación electrónico de la Organización donde se divulgan ambas revistas y cumplieron con el requisito de revisión arbitrada exigido en toda revista indexada. Además, tuvimos que cumplir con el requisito de ceder derechos de autor, como en toda revista indexada.
- 1.2. En la solicitud de 2do. Reingreso, presentamos el artículo de Conferencia “An experimental study for characterizing surface roughness by speckle pattern analysis”, que cumplió también con los requisitos de revisión por pares y no fue tomado en consideración (OSA Publishing <https://doi.org/10.1364/FIO.2015.FM1G.4>, ISBN: 978-1-943580-03-3). Para que este artículo fuera publicado y presentado, cumplió con los siguientes requisitos: Máximo de 15 palabras el título, 35 palabras en el Resumen o Abstract y 2 páginas de extensión del mismo, tal como aparece en las indicaciones del Congreso. Es decir, este artículo posee la equivalencia a un artículo tipo letter.
- 1.3. Las patentes presentadas “LASER CUTTING DEVICE (PCT/IB2016/0553 16)”, “PRESSURIZEDFLUID ABRASIVE CUTTING APPARATUS (PCT/IB2016/055313)”, “NOISE SUPPRESSION EQUIPMENT (PCT/IB2016/055577)”, cumplen con el proceso de revisión arbitrada y citando: “En lugar de este producto de investigación, también pueden contar, en igual cantidad y orden de autoría, 2 productos plenamente documentados mediante procesos equivalentes de evaluación por pares (Como se describe en los criterios internos de evaluación), tales como patentes”. En la documentación presentada en la solicitud, se puede notar que las tres patentes han pasado por un proceso de revisión equivalente al de revisión por pares, como en las revistas arbitradas, donde se describen los criterios de evaluación argumentados (adopción e impacto de las patentes) por los revisores técnicos

